

SEM-AFMによるコリレーション解析

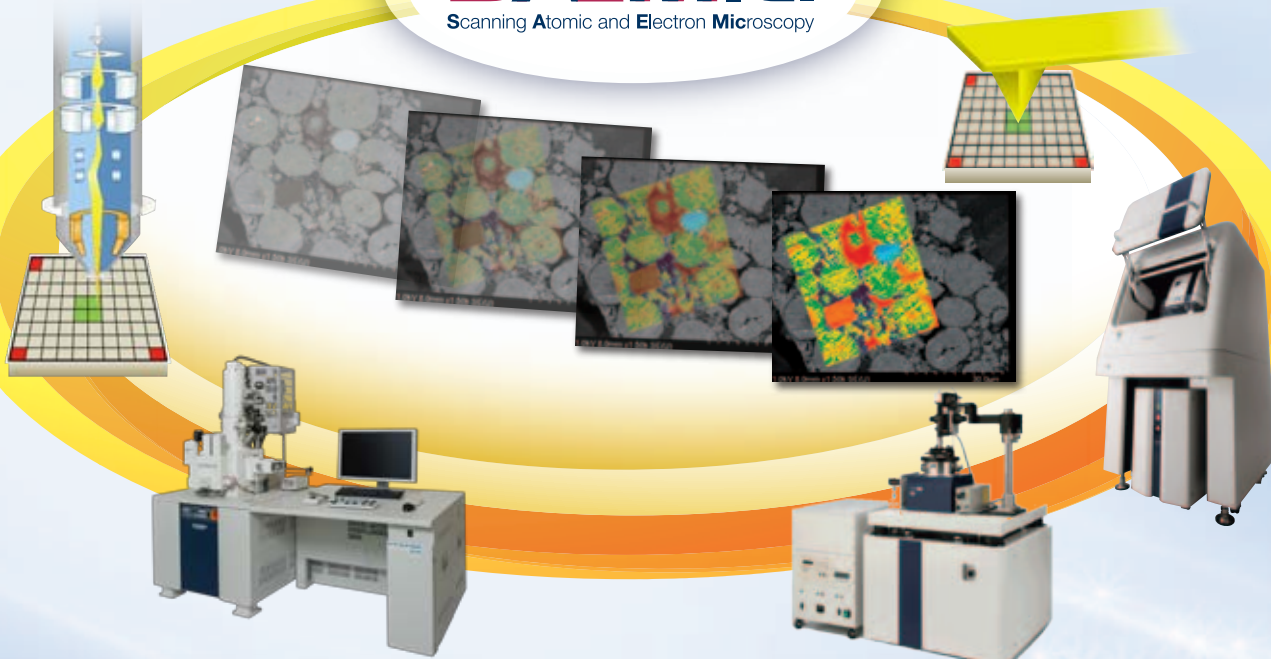
AFM5500M AFM5300E

The Innovative SÆMic. Solution

SEM+AFMの相関顕微鏡法



SÆMic.
Scanning Atomic and Electron Microscopy



SÆMic.

形状、組成、電位
元素分析(EDX)
結晶方位解析(EBSD)

- ◆ SEM像による広い領域からの迅速なROI(関心領域)決定
- ◆ EDX、EBSDなどのマイクロアナリシスによる定性分析

SÆMic.

3D形状計測
力学物性(硬さ、吸着、摩擦)
電気物性(電流、抵抗、電位)
磁気物性(磁性)

- ◆ AFMによる高精度な3D形状計測
- ◆ AFM各物性モードによる物性値測定

- ◎ リンケージ機能(AF5500M)同一箇所でのSEM&AFM解析評価を高精度且つ手軽に実現
- ◎ 雰囲気遮断共通ホルダ(AF5300E)による雰囲気遮断下でのSEM&AFM解析評価を実現